

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 8, 2014

Влияние вида легирующей примеси на точечные дефекты в кристаллах PbMoO_4 <i>Ю. Н. Горобец, И. А. Каурова, Г. М. Кузьмичева, А. Н. Шеховцов, В. Б. Рыбаков, А. Куссон</i>	3
Исследование электрофизических параметров голографического микроскопа <i>Н. В. Егоров, В. В. Трофимов, С. Р. Антонов, А. Г. Федоров, Л. И. Антонова</i>	14
Сопряжение фаз в углесталле <i>В. Н. Кукин</i>	18
АСМ-исследование внеклеточного матрикса соединительной ткани при пролапсе тазовых органов <i>С. Л. Котова, А. Б. Шехтер, П. С. Тимашев, А. Е. Гуллер, А. А. Мудров, В. А. Тимофеева, В. Я. Панченко, В. Н. Баграташвили, А. Б. Соловьева</i>	24
Влияние толщины на доменную структуру пленок титаната бария–стронция на подложках MgO <i>А. Н. Кускова, Р. В. Гайнутдинов, О. М. Жигалина</i>	32
Методы РЭМ и РСФА для исследования и контроля морфологии поверхности металлополимерных пленок <i>М. И. Мазурицкий, Ш. И. Дуймакаев, Л. М. Скибина</i>	38
РЭМ-изображения микро- и наноструктур в режиме обратно рассеянных электронов. 1. Метод исследования <i>Ю. А. Новиков</i>	46
Анализ дислокационной структуры в гетерогранице Ge/Si(111) <i>А. С. Ильин, Е. М. Труханов, С. А. Тийс, А. К. Гутаковский</i>	58
Исследование кремния, имплантированного ионами цинка и кислорода, методом спектроскопии резерфордского обратного рассеяния <i>В. В. Привезенцев, В. С. Куликаускас, В. В. Затекин, Д. В. Петров, А. В. Макунин, А. А. Шемухин, А. В. Лютцау, А. В. Путрик</i>	65
Термостимулированные поверхностные сегрегационные процессы в ионных кристаллах: хлорид калия <i>Ю. Я. Томашпольский, В. М. Матюк, Н. В. Садовская, П. С. Воронцов</i>	73
Морфология наноструктур $\text{Si/SiO}_2/\text{Ni}$ с треками быстрых тяжелых ионов в оксиде кремния <i>С. Е. Демьянов, Е. Ю. Канюков, А. В. Петров, Е. К. Белоногов, Е. А. Стрельцов, Д. К. Иванов, Ю. А. Иванова, С. Trautmann, Н. Terryn, М. Petrova, J. Ustarroz, V. Sivakov</i>	77
Распределение дейтерия и водорода в сборке $\text{Ta}[(\text{CD}_2)_n]\text{Ta}$ -фольг при воздействии импульсной азотной высокотемпературной плазмы <i>А. Ю. Дидык, Е. Хаевска, А. Хофман, В. С. Куликаускас, С. В. Серушкин</i>	87
Об особенностях магнитной структуры сферических наночастиц железа <i>В. В. Углов, В. М. Асташинский, Н. Т. Квасов, И. Л. Дорошевич</i>	95
Параметры катодного пятна при F -эмиссии <i>В. Н. Арустамов, Х. Б. Ашуров, Х. Х. Кадыров, Р. Б. Нагайбеков, И. Х. Худайкулов</i>	102
Модельные оценки поляризационных сил при движении точечного заряда в углеродных нанотрубках <i>В. А. Александров, Г. М. Филиппов</i>	106
Влияние динамических напряжений на распределения смещенных атомов при прохождении заряженных частиц через кристалл <i>Л. К. Израилева, Э. Н. Руманов</i>	111